

1時間あたり利用料金(円・税込)		タイプA	タイプB	タイプC	タイプD	タイプE	タイプF
		x0.35	x0.50	x0.56	x0.70	x0.80	x1.00
透過電子顕微鏡	極低温高分解能透過電子顕微鏡 JEOL / JEM-2100F(G5)	7,900	11,280	12,630	15,790	18,050	22,560
	球面収差補正透過電子顕微鏡 JEOL / JEM-2200FS	5,990	8,550	9,580	11,970	13,680	17,100
	モノクロメータ搭載 低加速原子分解能分析電子顕微鏡 JEOL / JEM-ARM200F	8,980	12,840	14,380	17,970	20,540	25,670
試料作製装置群	デュアルビーム走査電子顕微鏡 * (FIB-SEM) JEOL / JIB-4700F	11,630 (13,430)	16,620 (18,420)	18,610 (20,410)	23,260 (25,060)	26,580 (28,380)	33,230 (35,030)
	イオンスライサー JEOL / IB-09060CIS	1,370	1,950	2,180	2,730	3,120	3,900
	マイクロトーム Leica / ULTRACUT UCT	540	780	870	1,090	1,240	1,550
技術料	技術代行	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800
	技術補助 **	3,080	4,400	8,800	8,800	8,800	8,800

* カッコ内はFIB利用時の料金(Gaイオン源利用料として30円/分を加算) ** 割引は学術研究機関の利用にのみ適用

利用タイプ区分表

	成果公開		公開		非公開
	あり	なし	あり	なし	なし
学術	A	B	—	—	—
共同研究***	A	B	E	—	—
中小企業	A	B	F	—	—
大企業	C	D	F	—	—

*** 学術研究機関との共同研究による企業の利用

補足事項

成果の公開・非公開は、装置利用が文部科学省「マテリアル先端リサーチインフラ(ARIM)事業」に基づく利用かどうかを示し、利用報告書の提出の有無に対応します。利用報告書はARIM事業のホームページにて公開されますが、必要に応じて提出後2年間まで公開を猶予することができます。
(参考) https://nanonet.mext.go.jp/user_report.php (利用報告書 | ARIM Japan)

データ提供の有無は、装置利用にかかわる主要なデータ(「電子顕微鏡写真」・「測定・分析データ」・「測定・観察条件」・「試料に関する情報」)のRDE(データ蓄積・共用サービス)への登録の有無に対応します。登録されたデータは約2年間の非共用期間を経てデータ利用者による利用が可能となります。登録する項目については利用者の意思が反映されますが、最低基準を満たさない場合はこの区分での利用をお断りすることがあります。
(参考) https://nanonet.mext.go.jp/data_service/page/page000544.html (データ登録/利用パンフレット | ARIM Japan)

利用タイプ区分における「中小企業」は、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条における中小企業を指します。

利用タイプ区分における「共同研究」は、京都大学に限らない学術研究機関との共同研究による企業の利用を指します。(契約書等の証明書を提示いただく場合があります。)

通常と異なる消耗品を使用する場合には消耗品費実費を請求することがあります。(高温ホルダ用特殊メッシュ・薄型カーボン膜等の高額なもの、あるいは大量に使用する場合等)

機器利用前後のデータ解析や試料前処理等の依頼については、技術料(技術代行・技術補助)を請求させていただきます。